

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МИКРОСКОПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УИМ-21, УИМ-23, УИМ-29**

**Методы и средства поверки
МИ 236-81**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МИКРОСКОПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УИМ-21, УИМ-23 и УИМ-29
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
МИ 236-81

Ленинград
1982

Разработаны научно-производственным объединением «Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева».

Исполнители: канд. техн. наук М. Г. Богуславский,
Т. Н. Дмитриева, Е. П. Алексеева.

Утверждены научно-производственным объединением «Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева».

ВНИМАНИЕ!

1. Проверку по п. 3.3.12 производить не требуется.
2. Вместо определения стабильности положения осветительных насадок (п. 3.3.22) произвести определение отклонения от параллельности оптических осей визирной и осветительной систем.
3. Определение отклонения от параллельности оптических осей визирной и осветительной систем производить с помощью приспособления, изображенного на черт. 8 приложения, которое устанавливается в тубусе визирной системы вместо объектива. Это приспособление проецирует изображение диафрагмы в поле зрения визирной системы прибора. Проверку производить последовательно с осветительными насадками 1; 1,5 и 3—5^x. Для каждой насадки установить соответствующий диаметр диафрагмы: для насадки 1^x — 4,5 мм, для насадки 1,5^x — 3 мм, для насадки 3—5^x — 2 мм. Измерить с помощью линейки расстояние от центра штриховой сетки до центра изображения диафрагмы на экране. Полученные значения не должны превышать 10 мм для насадки 1^x, 23 мм для насадки 1,5^x и 25 мм для насадки 3—5^x, что соответствует отклонению от параллельности 30′.

Круглые столы СТ-9 и СТ-26, применяемые при проверке по п. 3.3.26, в комплект микроскопа не входят.

4. Микроскоп и его принадлежности должны находиться в помещении при температуре $(+20 \pm 2)^\circ \text{C}$.

5. Для проверки по п. 3.3.6 уровень взять из комплекта микроскопа.

6. Снятие показаний a_1 , a_2 и т. д. (п. 3.3.9) производить при зафиксированном положении. Разность между наибольшим и наименьшим показателями не должна быть более 0,018 мм. Проверку при открепленном стопорном винте не производить.

Определение отклонения от перпендикулярности перемещения тубуса при вращении микрометрического винта точной фокусировки производить не требуется.

7. Определение смещения изображения лезвия ножа при наклоне колонки (п. 3.3.11) производить с помощью бинокулярной насадки.

Проверку производить с открепленным стопорным